



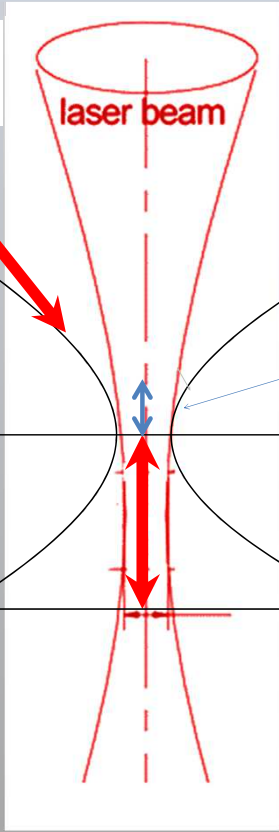
日本発明大賞 奨励賞

PhotoMask欠陥検査装置

これまでにない革新的欠陥検査 LODAS-Inside

列真の強み → 表面・内部・裏面同時検査

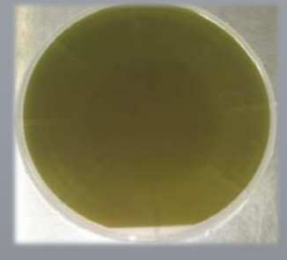
LODAS-Insideの
超長深度レーザービーム



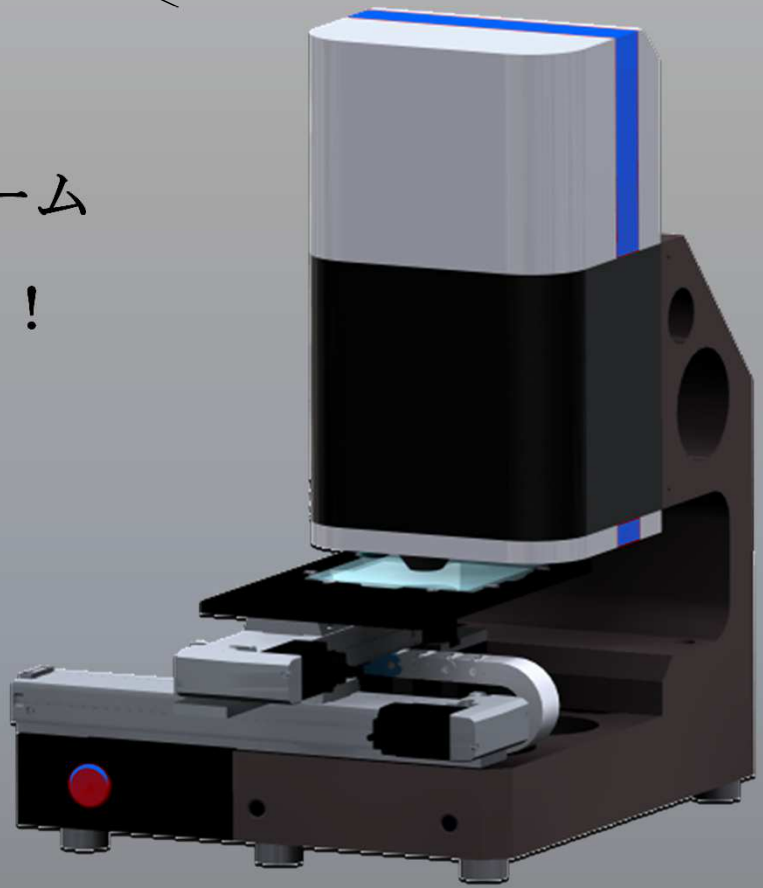
他社表面検査
レーザービーム

超長深度レーザービーム
が内部検査を決める！

検査対象：



石英ガラス SiCウエハ



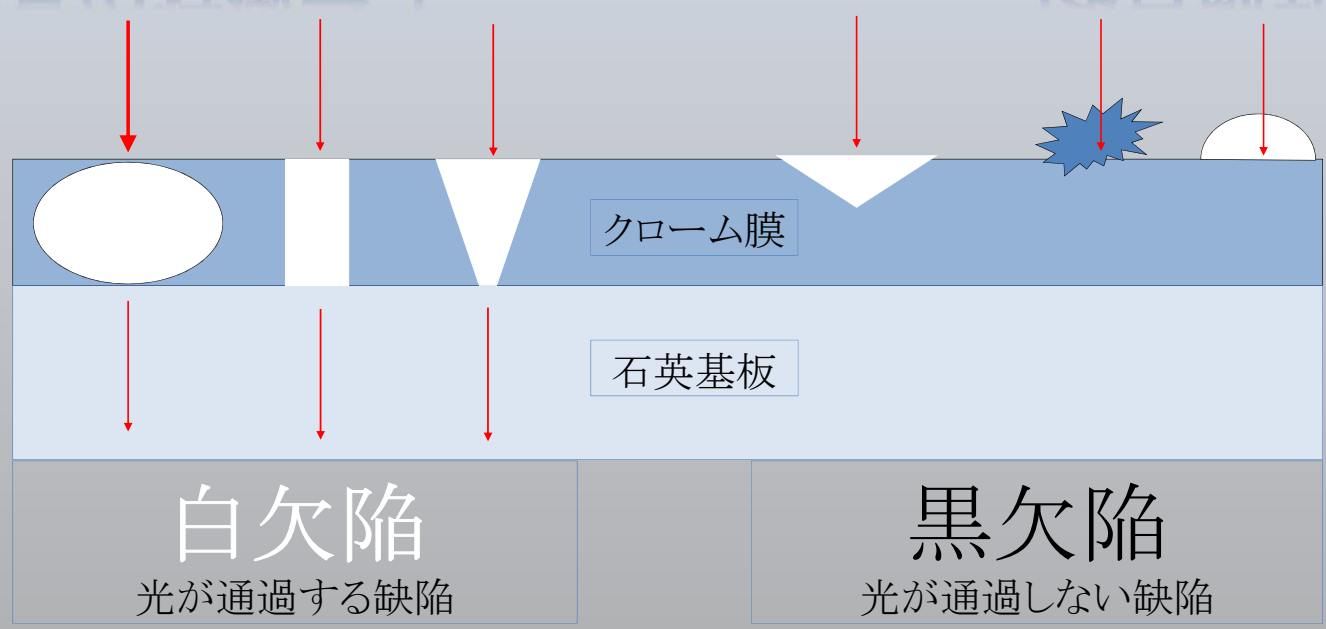
はたらく検査装置



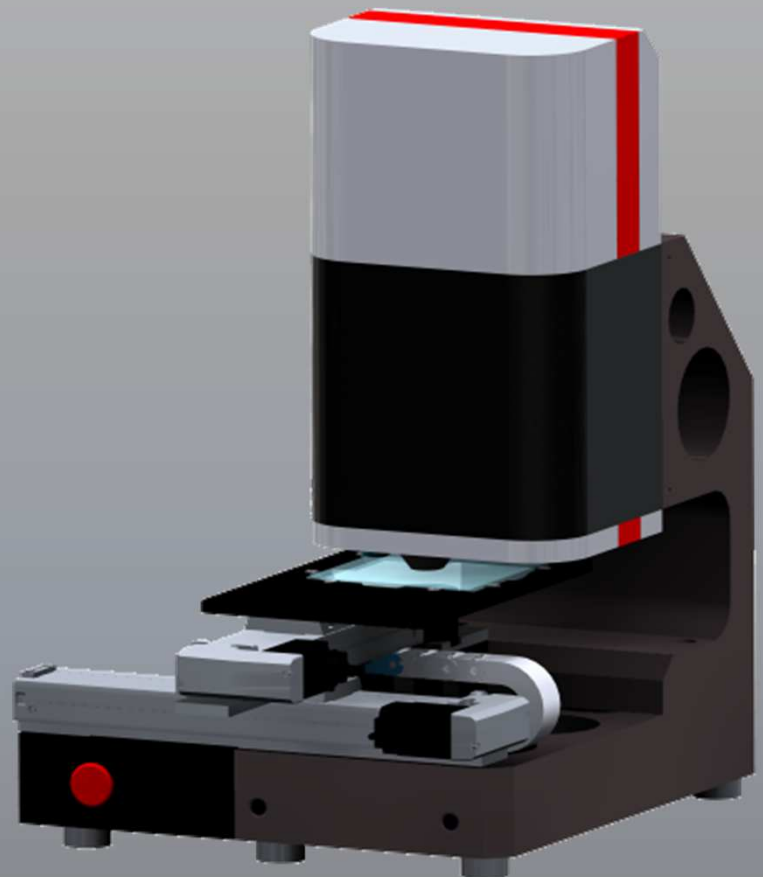
PhotoBlanks欠陥検査装置

これまでにない革新的欠陥検査 LODAS-Blanks

列真の特徴 → 「白欠陥 ・ 黒欠陥」を自動判定



- ◆ 反射、透過による同時検査
- ◆ 高感度: > 0.1 μ mPSL
- ◆ 最小検査時間: 120秒
- ◆ Review顕微鏡標準搭載
- ◆ 3年間安心保証



デモ無料

Photomask Japan 2018 展示内容

Booth
18

列真 (株)
LAZIN CO., LTD.

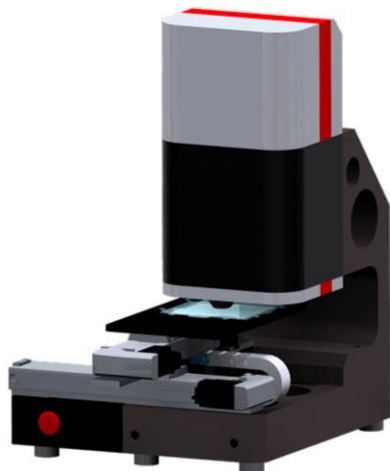
<http://lazin.jp/>

〒120-0026 東京都足立区千住旭町38-1-417
#417, 38-1 Senju Asahicho, Adachi-ku, Tokyo 120-0026, Japan

Phone : +81-3-5284-6477
Fax : +81-3-5284-6478
chotosyo@lazin.jp

製品一、日本発明大賞 受賞技術 (2017年)
フォトマスク石英基板内部欠陥検査装置 LODAS-Inside
特徴1.世界初! 欠陥サイズ1 μ m以上の内部欠陥が検出可能、特徴2.最大基板厚 t=20mm、特徴3.Review顕微鏡にて欠陥形状測定機能標準搭載
製品二、卓上式マスクブランク検査 LODAS-Blanks
特徴1.白欠陥、黒欠陥 自動仕分け、特徴2.最高感度100nmPSL、高速検査200sec (6025)、特徴3.高感度Review機能搭載、解析時間: 2秒/個

- 1, Substrate internal defect inspection machine LODAS-Inside
 - F1. Internal defects with defect size of 1 μ m
 - F2. Maximum board thickness 20 mm
 - F3. Defect shape measurement function with DIC microscope
- 2, Mask blank inspection machine LODAS-Blanks
 - F 1. White defect, black defect automatic classification
 - F 2. Sensitivity 100 nm PSL,TP: 200 sec (6025)
 - F 3. Review function, analysis time: 2 sec / piece



卓上式レーザー欠陥検査装置
LODAS-Blanks
デモ機実演



列真株式会社

F201+F202

